# Abstract:

PURPOSE: To enable the detection of dirts and flaws on a film original and an optical member with a relatively simple construction, by providing a wavelength selecting means adapted to mainly transmitting infrared rays, a displacing means and a detecting means.

CONSTITUTION: When a wavelength selecting means (a) adapted to mainly transmit infrared rays is inserted into an optical path of a reading optical system, an optoelectric transducer is displaced by a displacing means (b) from the image forming position of a projection optical system in substance to read image information of a film original from the optoelectric transducer. Here, this optoelectric, transducer is used in common to read image. Then, on the basis of the image information thus read out, a detecting means (c) detects the position of dirts and flaws on the film original. This eliminates possible deviation in the position between a visible light image data and infrared ray image data, thereby inhibiting detection errors caused by dirts and edges of flaws. (From: *Patent Abstracts of Japan*, Section: P, Section No. 663, Vol. 12, No. 42, Pg. 105, February 06, 1988)

#### **JAPIO**

© 2003 Japan Patent Information Organization. All rights reserved. Dialog® File Number 347 Accession Number 2272052

# Japanese Patent Publication No. 6-78992

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11)特許出願公告番号

特公平6-78992

(24) (44)公告日 平成6年(1994)10月5日

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号

FΙ

技術表示箇所

G 0 1 N 21/89 H 0 4 N 1/04 A 8304-2 J

庁内整理番号

Z 7251-5C

発明の数1(全 15 頁)

(21)出願番号

特願昭61-31692

(22)出願日

昭和61年(1986) 2月14日

(65)公開番号

特開昭62-188952

(43)公開日

昭和62年(1987) 8月18日

(71)出願人 999999999

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72) 発明者 平松 明

神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キ

ヤノン株式会社玉川事業所内

(72)発明者 佐藤 雄一

神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キ

ヤノン株式会社玉川事業所内

(72) 発明者 恒川 十九一

神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キ

ヤノン株式会社玉川事業所内

(74)代理人 弁理士 谷 義一

審査官 白石 光男

最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称 】 画像読取装置

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】光情報を電気信号に変換するための光電変換手段と、

特定波長の可視光を透過する第1のフィルタと、

特定波長の可視以外の光を透過する第2のフィルタと、前記第1のフィルタを介して前記光電変換手段に対象画像からの可視光を結像する場合と、前記第2のフィルタを介して前記光電変換手段に前記対象画像からの可視以外の光を結像する場合とで光路長を異なったものとするための光路長補正手段とを有することを特徴とする画像読取装置。

#### 【発明の詳細な説明】

## [産業上の利用分野]

本発明は、可視光及び可視以外の光を透過する複数のフィルタを用いて画像を読み取る画像読取装置に関する。

#### [従来の技術]

従来のこの種のフィルム画像情報読取装置(以下、フィルムスキャナーと称する)では、一般にマイクロフィルムあるいは写真フィルム等のフィルム原稿の背後から、照明光学系によりフィルム原稿を照明し、その透過光を投影光学系を介して光電変換素子の結像面に投影・結像し、その光電変換素子により光電変換することによりフィルム原稿の画像情報を電気信号に変換していた。 しかし、このような従来装置は構成されていたので、照

しかし、このような従来装置は構成されていたので、照明光学系および投影光学系に付着したごみ、フィルム原稿上の傷やごみが、読み取った画像データ上に黒点となって表われ、結果的に画質劣化をもたらすという問題があった。

第2図(A), (B)は上述のごみや傷の画像データおよび出力画像への影響を模式的に示したものであり、本

図(A)はリパーサルフィルムの場合、本図(B)はネガフィルムの場合である。本図(A),(B)に示すように、リバーサルフィルムおよびネガフィルムのいかんにかかわらず、フィルム原稿をフィルムスキャナーで画像信号に変換して読み取った場合、上述のごみや傷は、画像信号上に黒点となって現われる。

その結果、本図(A)に示すように、リバーサルフィルムの場合は、上述の画像信号をそのままガンマ補正等の画像処理をしてプリンタ等の出力装置へ出力するので、上述のごみや傷の影響はそのまま黒点となって出力画像に現われるという問題があった。

一方、ネガフィルムの場合は、本図(B)に示すように、フィルムスキャナーで読み取った画像信号をフルレベルで読み取った画像信号から減算することにより、ネガ画像からポジ画像への変換を行っているので、上述のごみや傷の影響は、白い輝点となって出力画像に現われるという問題があった。

そこで、赤外光に対するフィルムの透過率特性に着目して、上述の画質劣化の原因となるごみや傷のみを原稿を透過する赤外光により検知し、検知したごみ情報により読み取った画像データに修正を加えるというフィルムスキャナーがすでに提案されている。

#### [発明が解決しようとする問題点]

しかしながら、このような提案の装置では、ごみや傷の 検知用センサと画像データ読取用センサとをそれぞれ個 別に備えているので、画面一致の必要から双方センサー の位置合わせに非常な高精度を必要とするが、実際上そ の厳密な位置合わせは不可能である。

そのため、その提案装置ではごみ検知用センサにより検知したごみの情報を電気的に拡張して、見かけ上大きくし、この拡張したデータを基に画像データに修正を加えるというような複雑な処理システムを要するという欠点があった。

本発明の目的は、特定波長の可視光を透過する第1のフィルタと、特定波長の可視以外の光を透過する第2のフィルタを用いて共通の対象画像を読み取る際に、光路長を良好に制御できる画像読取装置を提供することにある。

[問題点を解決するための手段及び作用]

上記目的を達成するため本発明の画像読取装置は、

光情報を電気信号に変換するための光電変換手段(実施 例ではリニアセンサー11に対応する)と、

特定波長の可視光を透過する第1のフィルタ (同じく色 分解フィルター35c, 35d, 35eに対応する) と、

特定波長の可視以外の光を透過する第2のフィルタ (同じくIRフィルター35f) と、

前記第1のフィルタを介して前記光電変換手段に対象画像からの可視光を結像する場合と、前記第2のフィルタを介して前記光電変換手段に前記対象画像からの可視以外の光を結像する場合とで光路長を異なったものとする

ための光路長補正手段(同じく駆動機構13)とを有することを特徴とする。

#### [実施例]

以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。

第1図は本発明実施例の基本構成を示す。

本図において、aは波長選択手段であり、照明光学系もしくは投影光学系の光路中に挿入自在に配設される。b は変位手段であり、波長選択手段aが光路中に挿入されたときに、光電変換素子を実質的に投影光学系の結像位置から変位させる。

c は検知手段であり、変位手段 b により変位された光電変換素子から読み取った画像情報を基に光学系およびフィルム原稿上のごみや傷の位置の検知を行う。

第3図(A), (B) は典型的なネガフィルムおよびリバーサルフィルムのそれぞれの分光透過率を示す。本図(A) はネガフィルムの未露光での分光透過率特性、本図(B) はリバーサルフィルムの未露光での分光透過等性を示すものである。ここで、横軸は波長、縦軸は透過率を表す。本図(A), (B) に示すように赤外領域、たとえば800m以上の波長では、ネガフィルムおよびリバーサルフィルム共に透過率が高いことが理解される。またこの赤外領域の透過率は可視領域(350~700 nm程度)の透過率の大小によってほとんど変化せず高い透過率であることが実験的に確認されている。すなわち、800m以上の赤外領域の波長に注目すれば、フィルム画像情報とは無関係に受光面での照度むらを測定することが可能となることが分る。本発明実施例はこの原理を利用して以下に詳述するシェーディング補正を行う。

第4図は本発明実施例のフィルムスキャナーの概略構成 を示す。

本図において1はフィルム原稿を照明する照明ランプ、2は照明光を集光するコンデンサーレンズ、3は防熱フィルターであり、これらのランプ1とコンデンサーレンズ2および防熱フィルター3により照明系を構成している。4は第7図で後述のフィルター交換機構、5は第6図で後述のシャッター機構である。6はフィルム原稿を走査する第5図で後述の副走査系であり、光軸にほぼ直角な図面の上下方向(副走査方向)にフィルム原稿を順次走査する。7はフィルム原稿の透過光をセンサー11に結像する投影レンズであり、投影の倍率が可変なズーム機能を備えている。

また、8は枢軸を中心に回動自在の全反射ミラーであって、ファインダー観察時には光路中(図示実線位置)にあり、フィルム走査中は図中の一点鎖線位置に公知の駆動機構、たとえばロータリープランジャー等により駆動されて退避する。9はファインダのピント板であり、フィルム原稿を使用者が観察するためのものである。10は透明ガラス基板上にパターニングされた測光用センサーである。

センサー11はCCD等の自己走査タイプのラインセンサーであり、光軸と直角でかつ副走査系6の走査方向(副走査方向)と90°ずれた図面垂直方向(主走査方向)に配置されている。12は測光用センサー10の測光出力を基に、ラインセンサー11の受光面照度を制御(調節)する、例えば絞り機構、NDフィルター等の光量調節機構であり、本例では投影レンズ7の位置に配設されている。13はセンサー11を光軸方向に微小量変位させるための駆動機構であり、たとえば積層圧電素子からなり数10μmオーダーの変位が可能なものである。なお、1-1は光軸を示す。

第5図は第4図の副走査系6の詳細な構成例を示す。本図において、21は図中の矢印方向(副走査方向)に移動可能に支持される走査部(キャリッジ)、22は走査部21を矢印の移動方向(副走査方向)に支持する案内用レール、23は後述の駆動モータ(26)により回転されて走査部21を駆動する送りねじ、24および25はレール22と送りネジ23とを基合(図示せず)に対して両端で支持する支持部である。

26は送りねじを回転して走査部21を図中の矢印方向に駆 動する駆動モータであり、パルス駆動によりセンサー11 の読み取りピッチに応じてステップ的に駆動するステッ プモータである。27は走査部21上に固定されて走査部21 と一体となって移動するフィルム原稿ホルダーである。 27a,27bはホルダー27の一対のガラスであり、フィルム 原稿を間にはさんでフィルム原稿の平面性を高めてい る。特に、ガラス27a, 27bの表面およびガラス27a, 27bに はさまれるフィルム原稿表面のごみは投影レンズにより センサー11の受光面と結像関係またはその近傍にあるの で、画像信号の一部として取り込まれ問題が大きい。 28, 29および30はそれぞれ走査部21の走査スタート位 置、中央位置、走査エンド位置を検知するスイッチであ り、走査部21の側面の3個所に一体に設けられた対応の 突起部21a,21b,21cによりON,OFF (開閉) される。すな わち、第1のスイッチ30が0Nのときは走査部21はスター ト位置にあり、第2のスイッチがONのときは走査部21は 中央位置にあり、第3のスイッチ28がONのときは走査部 21は走査エンド位置にある。スイッチ29による中央位置 の検知は、ファインダー9による画面全体を観察する時 に用いる。

第6図は第4図のシャッタ機構5の詳細な構成を示す。本図において、31および32. それぞれ回転軸31a, 32aを中心に回転可能に支持された遮光板、33および34はそれぞれ回転軸31a, 32を介して遮光板31, 32を回転駆動するロータリープランジャーである。また、本図中の2点鎖線で示す範囲AAはフィルム原稿の画面範囲である。ファインダー観察時には、遮光板31および32はロータリ

ファインター観祭時には、遮光板31および32はロータリープランジャー33,34により互いに外方に駆動されて、本図中の破線で示す開口位置にあり、フィルム原稿データの読み取り時には、ロータリープランジャー33,34に

より遮光板31および32は内側に駆動され実線で図示した 遮光位置にある。遮光板31,32はこの遮光位置にある 時、センサー11の受光部に対向するフィルム原稿の一部 のみが照明されるように、幅 a のスリット部31bを残し て閉じており、残りのフィルム原稿部分は遮光板31,32 により遮光され、これによりゴーストフレア等による読 み取り画像データの画質の低下を最小限に防止してい る。 I ー I は第3図と同様の光軸である。

第7図は第4図のフィルター交換機構4の詳細な構成を示す。本図において、35は光路IーI中に挿入される色フィルター等を保持するフィルターホルダーであり、支軸35gにより回転可能に支持される。フィルターホルダー35には、ファインダー観察時のための素通し部35bと、R(レッド),G(グリーン),B(ブルー)の色分解フィルター35c,35d,35eとをそれぞれ配設し、さらにフィルム原稿および光学系のごみ、きずの検知用としての可視光カット特性を有するIRフィルター(赤外線フィルター)35fを配設している。

35aは半円形のフィルターホルダー35の円周部に形成したギア(歯車)である。モータ37の駆動により小径のギア36、およびこのギア36と噛合する上述の大径のギア35 aを介してフィルターホルダー35を回転して、素通し部35bおよびR, G, B, IRフィルター部35c, 35d, 35e, 35fの1つを選択的に光路1-1中に挿入する。

また、フィルターホルダー35の側面上には、光路 I ー I 中に挿入されるフィルターの位置検知のためのパターン電極38a, 39a, 40a, 41a, 42a, 43aを配設している。すなわち、素通し部35bの位置に対応して電極43aを、Rフィルター35cの位置に対応して電極39aを、Gフィルター35dの位置に対応して電極40aを、Bフィルター35eの位置に対応して電極41aを、IRフィルター35fの位置に対応して電極41aを、IRフィルター35fの位置に対応して電極42aをそれぞれ配設しており、これらのパターン電極のそれぞれが導通される。

さらに、上述の電極38a, 39a, 40a, 41a, 42a, 43aに対応して、それぞれブラシ38b, 39b, 40b, 41b, 42b, 43bを配置している。いま、仮に電極38aと常時接するブラシ38bがグランドレベル(大地電位)であるとすると、第6図に示すように光路中に、素通し部35bが挿入されている場合にはブラシ43bがローレベルとなり、Rフィルタ35cが挿入されている場合はブラシ39bがローレベルとなり、Gフィルタ35dが挿入されている場合にはブラシ40bがローレベルとなり、Bフィルタ35eが挿入されている場合にはブラシ41bがローレベルとなり、IRフィルター35fが挿入されている場合にはブラシ41bがローレベルとなる。IPフィルタコ35fが挿入されている場合にはブラシ42bがローレベルとなる。

第8図はフィルターホルダー35のR, G, B, IRの各フィルター35c, 35d, 35fおけるスペクトルに対するリニアセンサー11の分光感度まで含めた総合的な分光感度を示す。ここで、横軸は波長、縦軸は感度を表わす。本図に示すようにIRフィルター35fを使用中は、特に800nm以上の赤外

領域の波長において、リニアセンサー11は光電変換する ことになる。

第9図においては、Bは可視光フィルタ(例えばBフィルタ35e)、IRはIRフィルター35fのフィルム同位置における出力例を示す。すなわち、第9図のB, IRはそれぞれリニアセンサー11の1ラインの出力を示しており、本図のBにおいては透明カラーフィルム原稿上の画像の濃淡がセンサー11の出力の大、小として明確に再現されている。しかし、波形Bでは図中矢印で示されるごみによる画像情報の欠落は画像信号との判別が困難である。

一方、IRで示すIRフィルター35fを使用時のセンサー出力はBに示すBフィルタ35eを使用時の画像出力の大小にかかわらず、一定の出力となり、ごみや傷の部分のみ信号レベルが低く出力される。従って、適切なスライスレベルにより、IRフィルターのセンサ出力信号(IR画像データ)の大小を比較判断すれば、ごみの位置が検知できる。

このIRフィルターによるIR画像データ読み取り時には、 上述の第4図に示す駆動機構13によって、センサー11を 光軸方向(第4図の矢印×方向)に微小量変位させ、セ ンサー11を投影レンズ7の結像位置からはずれさせる。 この結果、センサー11上に投影される光学系のごみやフィルムの傷の像はピントぼけとなって、実際の大きさより大きな像としてセンサー11の出力に現われる。

第10図は第4図の本発明実施例のフィルムスキャナーの 回路構成を示す。本図において、101は第11図、第12図 に示すような制御手順に従って各モータやセンサーを制御する制御部である。102はミラー8の開閉を行うロータリープランジャ8aを駆動制御するミラー駆動部、103 はシャッター機構5のロータリープランジャー33、34を駆動制御するシャッター制御部、104はフィルター交換機構4のモータ37を駆動制御するフィルター制御部、および105は副走査系6のモータ26を駆動制御する走査制御部である。106はリニアセンサー11を駆動制御するセンサードライバーである。108はCCD等の自己走査タイプのリニアセンサー11の出力を順次アナログ・デイジタル変換するA/D(アナログ・デジタル)コンバータである。

109はセンサー11を微小変位させる駆動機構13を駆動制御する駆動部である。

次に、第11図および第12図のフローチャートを参照して、本発明実施例の動作を詳細に説明する。

いま、ファインダを通じてフィルム原稿を肉眼で観察する時には、ミラー8は1-1の光路中にあり、かつ副走査系6のフィルム原稿ホルダー27の中心はその光路の中央位置にあり、またシャッタ機構5の遮光板31,32は開状態で、さらにフィルター交換機構4の素通し部35bが光路中に挿入されている。使用者(操作者)はこの状態において、フィルム原稿の画像状態をファインダのピント板9の映像により確認する。

次に、スタート卸110が押されて、走査開始信号 (スタート信号) 211が発生すると (ステップS1) 、制御部101はまずミラー駆動部102にミラー駆動信号201を出力してロータリープランジャ8aによりミラー8を光路中から退避させ (ステップS2) 、続いてシャッタ制御部103にシャッター駆動信号202を出力して、一対のロータリープランジャ33,34によりシャッタ機構5の遮光板31,32を遮光位置に駆動して、これによりゴーストフレア等の有害光を遮光する (ステップS3)。

また、同時に制御部101はフィルター制御部104にフィル ター制御信号203を出力して、光路中に色分解フィルタ を選択挿入させる。仮に、R,G,B,IRの順に画像データを 順に読み取るものとすると、フィルタ制御信号203に応 じてフィルター制御部104はまず、Rフィルター35cが光 路中に挿入されるまで、すなわちブラシ39bがローレベ ルになるまで、モーター37を駆動する(ステップS4)。 ブラシ39bがローレベルになると、フィルター制御部104 はフィルター交換終了を意味するフィルタ交換終了信号 204を制御部101に返信する。ステップS5の第12図のサブ ルーチンにおいて、制御部101はフィルター交換終了信 号204を受信すると (ステップS101) 、走査制御部105に 走査開始信号205を送信する。走査制御部105は走査開始 信号205を受信すると、まず副走査系(キャリッジ)6 を走査スタート位置まで、すなわちスイッチ30がONにな るまで、ステップモーター26を駆動する(ステップS10 2) 。走査制御部105はこのスイッチ30が0Nとなると、走 査終了と判断して走査終了信号206を制御部101に返信す る。ここで、フィルタ原稿走査のための準備操作は終了

制御部101は走査終了信号206を受信後(ステップS10 3)、センサードライバー106に読み取り開始信号207を出力し、ドライバー106はこの開始信号207に応じてセンサー11を駆動する(ステップS104)。センサー11の出力信号(画像信号)209は順次A/Dコンバータ108によってデジタル信号に変換されて図示しない画像処理回路へ送られ、センサー11は出力信号209を所定画素数出力後、1ラインの読み取りを終了する。

この1ラインの読み取りの終了とともに(ステップS105)、制御部101は走査制御部105に対して走査制御信号205を出力し、走査制御部105はこの走査制御信号205に応じてパルスモーター26を所定ピッチ分駆動して副走査系6の1ライン分の副走査を終了する(ステップS106)。その後、ステップS104に戻って上述と同様にしてセンサー107を駆動し、1ラインの画像信号(R信号)を読み出す。以上のステップS104~S106の読み取り処理動作を所定サイクル(一画面分)繰り返すと(ステップS107)、R画像データの読み取りは終了する。

次いで、メインルーチンに戻って、ステップS6に進み、 制御部101はフィルター交換のためにフィルタ制御信号2 03によりフィルター制御部104を動作させて、Gフィル ター35dが光路!-!中に位置するまで、すなわちブラ シ40bがローレベルになるまで、モータ37を駆動させる (ステップS6)。

このようにしてGフィルター35dが選択された後、ステ ップS7へ進み、上述のR画面読み取りと同様な処理サイ クル (第12図のステップS101~S107) を繰返すことによ りG画面データを読み取る。

B画面データも上述と同様にしてリニアセンサー11から 読み出す(ステップS8,S9)。

B画面データ読み出し終了後、制御部101は、フィルタ 一制御信号203によりIRフィルタ35fを光路中に挿入させ (ステップS10) 、同時に制御信号212により駆動部109 を介して駆動機構13を駆動させ、これによりセンサー11 を光軸方向に変位させてIR画面読み出しのための準備を 終了する(ステップS11)。次に、ステップS12に進ん で、第12図のステップS101~S107の処理により上述と同 様にしてIR画面データを読み出す。

この一画面読み取りの終了後、第11図のメインルーチン に戻り、制御部101は走査制御信号205により走査制御部 105を動作してモータ26の回転により副走査系6を副走 査の中央位置に移動させ(ステップS13)、駆動終了後 すなわち、スイッチ29が0Nの後、フィルター制御信号20 3によりフィルター制御部104を介してモータ37を動作さ せて素通し部35bを光路中に挿入し(ステップS14)、ミ ラー駆動信号201によりミラー駆動部102を動作させてミ ラー8を光路中に戻す(ステップS15)と共に、シャッ ター駆動信号202によりシャッター制御部103を介してロ ータリープランジャ33,34を動作させて遮光板31,32を開 状態にする(ステップS16)。以上の処理により一連の フィルム原稿の画面読み取りの処理動作を終了する。

次に、光学系に付着したごみやフィルム原稿上の傷の検 知および画像信号修正処理について説明する。

第13図は、本発明実施例における上述のごみや傷の検知 および画像信号修正処理部の概略構成を示す。本図にお

いて、301,302,303,304はそれぞれ、上述の第11図の制 御手順に従ってR, G, B, IRの各読み取り画像データ210をA /Dコンパータ108から受け取り記憶するイメージメモリ ーである。305はIRイメージメモリー304の画像データを 基に、ごみや傷の画面中の位置(アドレス)を検知する 検知部である。また、306は検知部305によって検知され たゴミ、キズの位置のデータ(アドレスデータ)を基 に、R, G, Bの各イメージメモリー301, 302, 303の画像デー タに、後述の画像信号修正処理を施す修正処理部であ る。

次に、第14図のフローチャートを参照して、ごみや傷の 検知等の処理動作を説明する。まず、IRイメージメモリ -304から画像データSij(iはライン方向,jは読み取り ラインのアドレス) を順次読み出す(ステップS301)。 上述の第9図で説明した原理に基づいて、ステップS301 で読み出した画像データSijをごみや傷の判定基準とし て定めた所定のスライスレベルより小か否かを判定し (ステップS302) 、そのスライスレベル以下の画像デー タのアドレス(i,j)を順次検知部305の内部メモリーに 記憶する(ステップ\$303~\$305)。

その後、修正処理部306は検知部305に記憶されたごみや 傷の位置を示すアドレス情報を基に、R, G, Bの各イメー ジメモリ301,302,303の画像データに、たとえば以下の ①~③のような修正処理を順次施す(ステップS306~S3 08) 。

ここで、Si jはR, G, B各イメージメモリー301, 302, 303の 画像データであり、検知部305により検知されたアドレ スに対応する画像データであるとする。

③ Sij=Si-1, j…ごみ画像データを直前の画像データ に置きかえる。

② Sij=  $(Si_{-1}, j+Si, j_{-1}+Si, j_{+1}+Si_{+1}, j) /4$ …ごみ画像データを上下左右の画像データの平均のデー タに置きかえる。

 $Si, j+m = Si, j+\frac{n}{m} (Si, j-Si, j+m+1)$ 

但しn=1~m

…ごみ画像データが複数画素に連なる場合、一連のごみ 画像データを直前、直後の画像データで内挿する。

①~③で示したこれらの方法はごみ画像データの修正処 理の一例である。これらの処理を施されたR, G, Bの各画 像データはR, G, B出力信号として外部へ出力される(ス テップS310)。

本実施例では、ピントをぼかすためにセンサーを光軸方 向に光軸方向に変位させたが、これに限定されず、投影 レンズの赤外収差を積極的に利用しても同様の効果が得 られる。

以上説明したように、本発明の実施例によれば、可視光 画像データとごみ、傷検知用の赤外画像データを同一の

イメージセンサーを用いて読み出して、処理するように したので、可視光画像データと赤外光画像データとの位 置ずれをなくすことが可能であると共に、赤外画像デー タの読み取り時に、センサー位置を光軸方向に変位させ てピントをぼかし、ローパスフィルター効果をもたせて いるので、ごみや傷の投影像を拡大することが可能で、 ごみや傷のエッジ部による検知誤差も抑制することが可 能となる効果を得ることができる。

#### [発明の効果]

以上の様に、本発明によれば、それぞれ可視光及び可視 以外の光を透過する複数のフィルタを用いて共通の対象 画像を読み取る際の光路長を良好に制御できる。

【図面の簡単な説明】

第1図は本発明実施例の基本構成を示すブロック図、

第2図(A), (B)は従来装置でのごみや傷の影響を示す模式図、

第3図(A). (B)はフィルムの未露光での分光透過 特性を示す特性図、

第4図は本発明実施例のフィルムスキャナーの概略構成 を示す模式図、

第5図は第4図の副走査系6の構成例を示す斜視図、

第6図は第4図のシャッター機構5の構成例を示す斜視 図

第7図は第4図のフィルター交換機構4の構成例を示す 斜視図、

第8図はR, G, B, IRの各フィルターの分光感度を示す特性 図、

第9図は可視光フィルターとIRフィルターのフィルム同位置におけるセンサー11の出力例を示す出力波形図、

第10図は第4図のカラーフィルムスキャナーの読取部の 回路構成を示すブロック図、

第11図および第12図は第10図の制御部101の制御手順を 示すフローチャート、

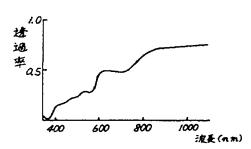
第13図は本発明実施例の検出修正部の回路構成を示すブロック図、

第14図は第13図の検出部と修正処理部の動作を示すフローチャートである。

1……ランプ、

2……コンデンサレンズ、

#### 【第3図(A)】



ネガスルムの未露光での分光透過率を示す特性国

3……防熱カットフィルタ、

4……フィルタ交換機構、

5……シャッタ機構、

6……副走査系、

フ……投影レンズ、

8……全反射ミラー、

9……ピント板、

10……測光用センサ、

11……センサー、

12……光量調節機構、

13 ······駆動機構、

26,37……モータ、

27……フィルム原稿ホルダー、

31,32……遮光板、

35……フィルターホルダー、

101 ·····制御部、

102……ミラー駆動部、

103……シャッタ制御部、

104……フィルター制御部、

105……走査制御部、

106……センサドライバー、

108……A/Dコンバータ。

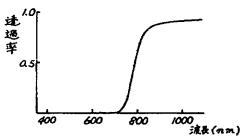
109……駆動部、

301~304……イメージメモリー、

305……検知部、

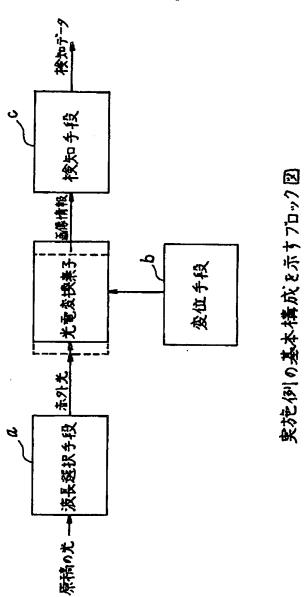
306……修正処理部。

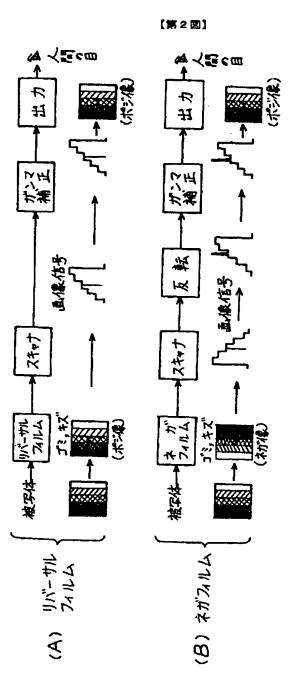
#### 【第3図(B)】



リバーサルフィルムの未露光での分光透過率を示す特性図

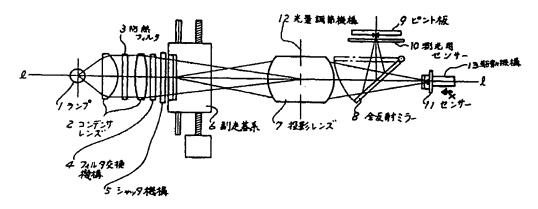
【第1図】



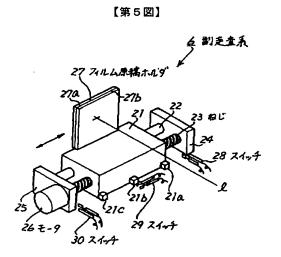


從来装置でのごみや傷の影響を示す模式図

# 【第4図】

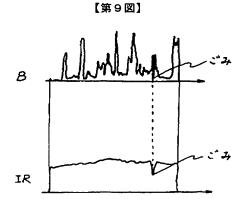


実施例のフォルムスキャナーの模式図

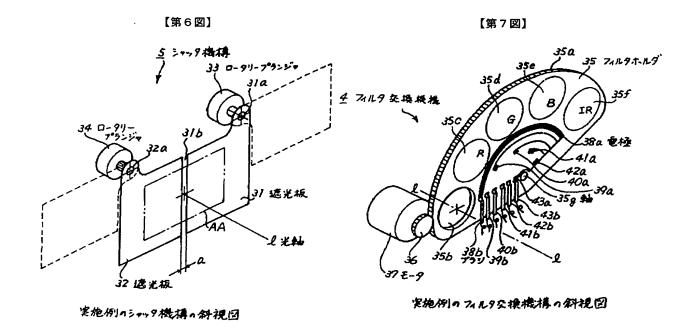


R.G.B. IRの各コルターの分光感度を示す特性図

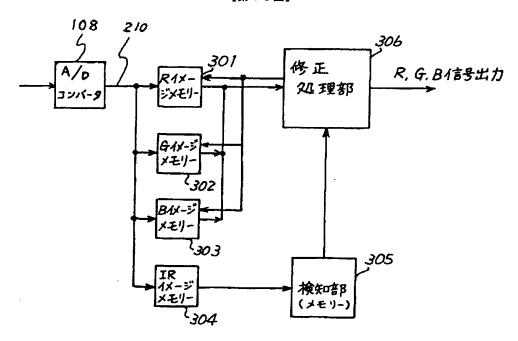
# 実施例の副走去系。斜視图



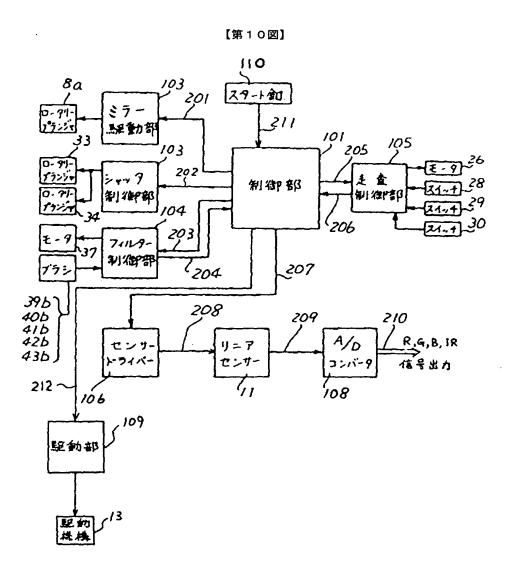
可視光プルタとIRプルタのプルム同位置におけるセンサーノ1の出力例を示す出力波形図



【第13図】

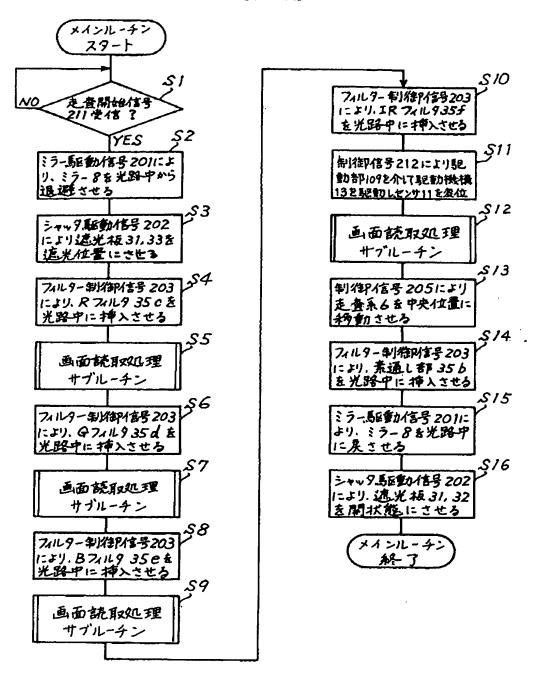


実施例の検出修正部の 回路機成を示すブロック図



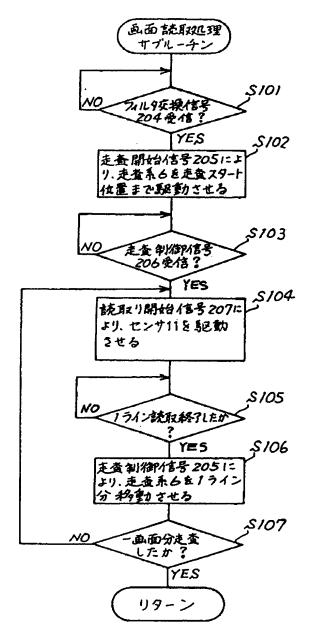
東右後の詩本部回路構成を示すブロック図

#### 【第11図】

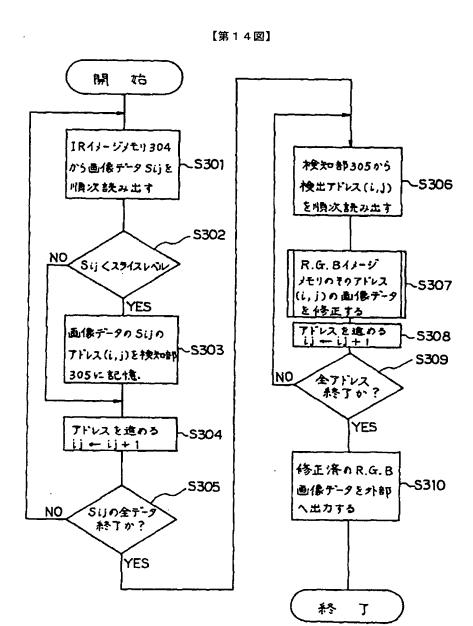


実施例の制御動作を示すフローチャート

#### 【第12図】



実施何りのサブルーチンのフローチャート



実施例の信号修正処理のフローチャート

#### フロントページの続き

# (72) 発明者 勝間 眞

神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キャン株式会社玉川事業所内

#### (72)発明者 山田 茂樹

神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キ ヤノン株式会社玉川事業所内 (72) 発明者 小林 剛

神奈川県川崎市高津区下野毛770番地 キャン株式会社玉川事業所内

(56)参考文献 特開 昭60-194660 (JP, A)

特開 昭49-1280 (JP, A)

特開 昭57-24808 (JP, A)

特公 昭53-5830 (JP, B2)